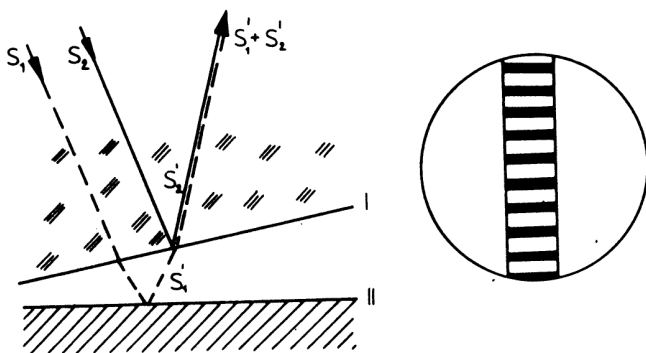


Univerzálny mikroskop Zeiss: 1 - základové teleso, 2 - pozdĺžne sane, 3 - priečne sane, 4 - okulár, 5 - pravítko pozdĺžnych saní, 7 - špirálový mikroskop priečných saní, 9 - upínacia pinola, 10 - upínací hrot, 12, 14 - skrutka upevnenia saní, 13, 15 - jemný posuv saní, 16 - pohyb objektívu, 17 - zaostrenie objektívu, 21, 23 - naklápanie objektívu, 22 - nastavenie clony



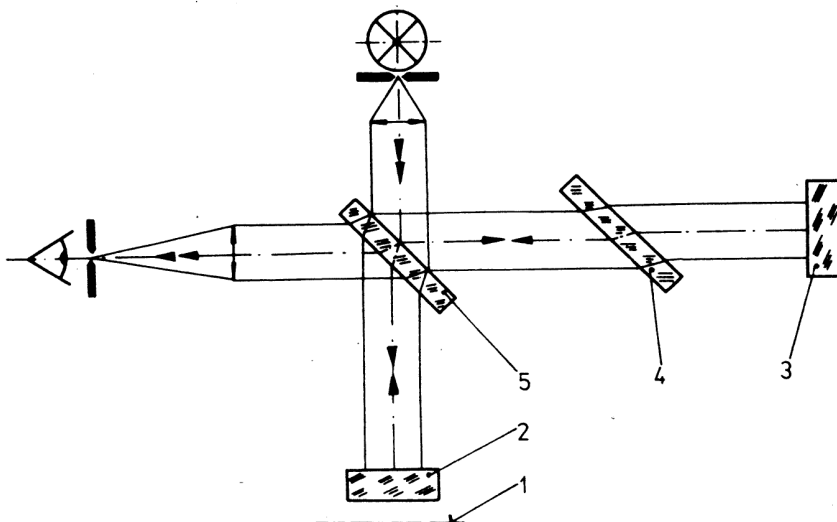
Obr. 2.3-33

Vznik interferencie v klinovej vrstve a interferenčné pásiky na meranej ploche

prístrojov, založených na princípe Michelsonovho interferometra, predovšetkým k presnému meraniu dĺžok a kontrole drsnosti povrchu veľmi jemne opracovaných plôch. Schéma Michelsonovho interferometra je na obr.

Vznik interferencie najlepšie poznáme na klinovej vrstve.

Ak položíme na hladkú lesklú plochu planoparalelnú doštičku a ľahkým tlakom ju posunieme nabok, vznikne medzi obidvomi styčnými plochami tenký vzdušný klin (obr. 2.3.33). V dôsledku rozdielnych dráh lúčov dochádza k zoslabovaniu a zosilovaniu intenzity svetla a k vzniku interferenčných prúžkov. Interferencia sa využíva predovšetkým ku kontrole rovinnosti planoparalelnými sklami a u celej rady



1 - referenčná rovina,  
5 - polopriepustná doska,  
2, 3 - zrkadlá,  
4 - sklenená doska,